

表面を制する者、材料を制す！！



表面分析セミナー



顕微鏡で試料の表面を観察するだけでは物足りないと感じたことはないでしょうか？

試料表面の元素組成、化合物の同定、一定深さ方向の解析など、さまざまな情報を得たいと思ったことはありませんか？

本セミナーでは、試料の表面に関する多彩で有益な情報を得るための各種分析技術やそれらの応用事例をご紹介します。

ご紹介する装置・設備は文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業の共用装置となっており、石川県能美市のJAIST(北陸先端科学技術大学院大学)をはじめ日本全国25の大学・研究機関にて、どなたでも利用することが出来ます。

10:30～ 基礎・原理編

2015.12.17

10:30～17:00 木

科学技術振興機構
東京本部別館 1階ホール

東京都千代田区五番町
7 K's五番町

入場無料

定員100名

市ヶ谷駅から徒歩3分！
途中参加も歓迎！

「光電子分光法(XPS)による表面分析の基礎と応用事例」
(吉田能英・(株)島津製作所)

「ナノテクプラットフォームでの支援事例紹介」
(村上達也・JAIST)

「二次イオン質量分析法(SIMS)の基礎と応用事例」
(三輪司郎・アメテック(株))

14:00～最先端の研究事例

「水を取り込むと構造化する燃料電池膜の研究」
(長尾祐樹・JAIST)

「有機薄膜太陽電池の評価事例」
(酒井平祐・JAIST)

「両親媒性高分子を用いた π 共役ユニットの精密集積化」
(山本俊介・東北大)

「SIMSによる高分解能元素イメージング」
(竹内美由紀・東京大)

Webフォームよりお申し込みください。
<https://ssl.form-mailer.jp/fms/629a1048392475>

詳細はこちらから！

mms-platform.com

検索

お問い合わせ先：分子科学研究所 分子物質合成プラットフォーム
TEL：0564-55-7431 FAX：0564-55-7448 担当：井上

